



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN23507X

Issue Date: 19 Aug 2020

Title of Change:	PQFN56 Wired Dual Source from Cebu to GEM – Phase 3	
Proposed First Ship date:	31 Dec 2020 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or RamilAngelo.Nonato@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or PCN.samples@onsemi.com . Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact PCN.Support@onsemi.com	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Parts can be distinguished by device marking	
Change Category:	Test Change, Assembly Change	
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Addition	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
ON Semiconductor Cebu, Philippines	GEM Shanghai	
Description and Purpose:		
ON Semiconductor Cebu, Philippines former Fairchild Semiconductor in Cebu, Philippines, has qualified GEM Shanghai as an alternate assembly and test site for Power 56 package. GEM Shanghai is a certified with ISO/TS 16949:2009 and is currently running mass production for PQFN 56 Wired Package. This package was previously qualified at GEM Shanghai, China by Fairchild in 2009 (PCN# :Q2102401). Marking date code & Tape/Reel & Label follow with ON Semiconductor standard format. These products will continue being Pb-free, Halide free and RoHS compliant. Qualification tests are designed to show that the reliability of the impacted devices will continue to meet or exceed ON Semiconductor standards.		
	Before Change	After Change
Assembly Site	ON Semiconductor Cebu, Philippines (OSPI, Cebu).	ON Semiconductor Cebu, Philippines (OSPI, Cebu) & Subcon GEM, China
Lead Frame	C194 Cu, NiPdAu plated	ON Semiconductor Cebu, Philippines (OSPI, Cebu) – C194 Cu, NiPdAu plated GEM Subcon – C194 Cu, bare Cu
Mold	CEL9240HF10LS	ON Semiconductor Cebu, Philippines (OSPI, Cebu) – CEL9240HF10LS GEM Subcon – CEL9240HF10L8
Marking	Ex-Fairchild Marking	ON Semiconductor Marking

**Qualification Plan:**

QV DEVICE NAME: FDMS86263P

RMS: F69686 & F70206

PACKAGE: PQFN8 ALCU SNGL HPBF

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 80% max rated V	1008 hrs
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta=150°C	1008 hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C, On/off = 2min	15000 cyc
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 5 sec	

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
FDMS4D4N08C	FDMS86263P
FDMS86163P	FDMS86263P
FDMS86263P	FDMS86263P

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23507X

発行日: 19 Aug 2020

変更件名:	PQFN56 ワイヤード供給をセブから GEM 追加でデュアルソース化 – フェーズ 3	
初回出荷予定日:	31 Dec 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < RamilAngelo.Nonato@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、< PCN.Support@onsemi.com > にお問い合わせください。	
部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:	製品マーキングによって製品を区別することができます。	
変更カテゴリ:	検査の変更、組立の変更	
変更サブカテゴリ:	製造拠点の追加	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
オン・セミコンダクター セブ、フィリピン	GEM 上海	
説明および目的: セブ (フィリピン) の旧フェアチャイルドセミコンダクターであるオン・セミコンダクター セブ (フィリピン) は、GEM 上海を Power 56 パッケージの組立および検査の代替拠点として認定しました。GEM 上海 は ISO/TS 16949:2009 で認証され、現在 PQFN 56 ワイヤードパッケージを量産中です。GEM 上海 (中国) におけるこのパッケージは 2009 年にフェアチャイルドによって認定されました (PCN#: Q2102401)。 日付コードのマーキング、そしてテープ/リールとラベルは、オン・セミコンダクターの標準フォーマットに従います。これらの製品は引き続き鉛フリー、ハロゲン化合物フリーであり、RoHS に適合しています。認定試験は、影響を受ける製品の信頼性が引き続きオン・セミコンダクターの基準以上となることを証明するように設計されています。		
	変更前の表記	変更後の表記
組立拠点	ON Semiconductor Cebu, Philippines (OSPI, Cebu).	ON Semiconductor Cebu, Philippines (OSPI, Cebu) & Subcon GEM, China
リードフレーム	C194 Cu, NiPdAu plated	ON Semiconductor Cebu, Philippines (OSPI, Cebu) – C194 Cu, NiPdAu plated GEM Subcon – C194 Cu, bare Cu
モールド・コンパウンド	CEL9240HF10LS	ON Semiconductor Cebu, Philippines (OSPI, Cebu) – CEL9240HF10LS GEM Subcon – CEL9240HF10L8
マーキング	Ex-Fairchild Marking	ON Semiconductor Marking



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23507X

発行日: 19 Aug 2020

認定計画:

デバイス名: FDMS86263P

RMS: F69686 & F70206

パッケージ: PQFN8 ALCU SNGL HPBF

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C、80% 最大定格 V	1008 時間
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C、100% 最大定格 Vgss	1008 時間
HTSL	JESD22-A103	Ta=150°C	1008 時間
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C、delta Tj=100°C、オン/オフ = 2 分	15000 サイクル
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C ~ +150°C	1000 サイクル
HAST	JESD22-A110	130°C、85% RH、18.8psig、バイアス付き	192 時間
uHAST	JESD22-A118	130°C、85% RH、18.8psig、バイアスなし	96 時間
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	
SD	JSTD002	Ta = 245°C、5 秒	

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FDMS4D4N08C	FDMS86263P
FDMS86163P	FDMS86263P
FDMS86263P	FDMS86263P